

高低温试验室测试流程介绍

产品名称	高低温试验室测试流程介绍
公司名称	深圳市信通检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区A2栋厂房401
联系电话	17318023119

产品详情

高低温试验室测试流程,高低温测试标准,你了解多少?

高低温振动冲击项目,深圳亿博高低温试验室拥有大型可靠性测试中心,CNAS CMA认可实验室,114实验室专业为客户提供高低温测试,快速温变,恒定湿热,交变湿热,冷热冲击,温湿度循环,三综合测试,高加速等温湿度测试全程专家指导一站式认证服务。

高低温试验室拥有大型可靠性测试中心,CNAS CMA认可实验室,114实验室专业为客户提供高低温测试,快速温变,恒定湿热,交变湿热,冷热冲击,温湿度循环,三综合测试,高加速等温湿度测试全程专家指导一站式认证服务。

一、高低温测试多少小时：

1、在样品断电的状态下，先将温度下降到-50°C，保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试，非常重要，因为通电状态下，芯片本身就会产生+20°C以上温度，所以，在通电状态下，通常比较容易通过低温测试，必须先将其“冻透”;，再次通电进行测试。

2、开机，对样品进行性能测试，对比性能与常温相比是否正常。

3、进行老化测试，观察是否有数据对比错误。

4、升温到+90°C，保持4个小时，与低温测试相反，升温过程不断电，保持芯片内部的温度一直处于

高温状态，4个小时后，执行2、3、4测试步骤。

5、高温和低温测试分别重复10次。

如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态，则视为测试失败。

二、高低温参考标准：

GB/T2423.1-2008试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008试验B：高温试验方法

GB/T2423.22-2002试验N：温度变化试验方法

高温高湿测试，高温高湿检测规格型号及技术参数：

ZT-CTH-80L，ZT-CTH-120L

ZT-CTH-150L，ZT-CTH-225L

ZT-CTH-306L，ZT-CTH-408L

ZT-CTH-800L，ZT-CTH-1000L

1.温度范围：-20~+150 /-40~+150 /-50~+150 /-60~+150 /-70~+150/-85~+150 。

2.控制稳定度：±0.5

3.分布均匀度：±1.5

4.温度偏差：±2

5.正常升温时间：+20 ~+150 小于45分钟非线性空载。

6.正常降温时间：+20~-20 小于45分钟/+20~-40 小于60分钟/+20~-50 小

于65分钟.+20~-60 小于70分钟/+20~-70 小于75分钟/+20~-88 小于100

分钟非线性空载.

7.湿度范围：20%~98%RH

8.湿度波动度：±1%RH

9.湿度均匀度：±3.0%RH